

1 Integrierter Heizer auf AlN-Substrat.

2 Heizerlayout auf einem Substrat aus  $\text{Si}_3\text{N}_4$ -Keramik (Beispiel Bügeleisensohle).

3 Temperaturverteilung auf einer Bügeleisensohle (Gleitseite und Heizerseite).

## INFRAROT-THERMOGRAPHIE

### Motivation

Die Temperaturverteilung gehört zu den wesentlichsten Parametern bei der Konstruktion von Heizermodulen und Baugruppen. Auch die zeitliche Analyse z. B. bei Aufheizvorgängen, Heizimpulsen oder chemischen Reaktionen ist bei vielen Anwendungen bedeutsam. Oft kann die Thermographie zur Lokalisierung von kritischen Stellen oder Defekten in Baugruppen eingesetzt werden, wobei auch kleinste Überhitzungen detektiert werden können.

- Die schnelle Vario-Therm im nahen IR (3,4 µm bis 5 µm) mit max. 50 Bilder/s und 25 µm Ortsauflösung
- Der Temperaturbereich umfasst 40 °C bis 1200 °C

### Leistungsangebot

- Analyse der statischen und dynamischen Temperaturverteilung an Heizersystemen und elektronischen Baugruppen bei unterschiedlicher elektrischer und thermischer Belastung
- Belastungstests an Heizermodulen und Widerstandsschichten unter variablen Lastbedingungen wie konstante, stufenweise ansteigende oder impulsförmige Heizung

### Ausrüstung

Es stehen zwei Systeme der Firma JENOPTIK Jena zur Verfügung:

- Das scannende hochauflösende (0,03 K) Thermographiesystem Vario-Scan im fernen IR (8 µm bis 12 µm) mit max. 1 Bild/s oder 200 Linien/s

### Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS

Winterbergstraße 28

01277 Dresden

Ansprechpartner

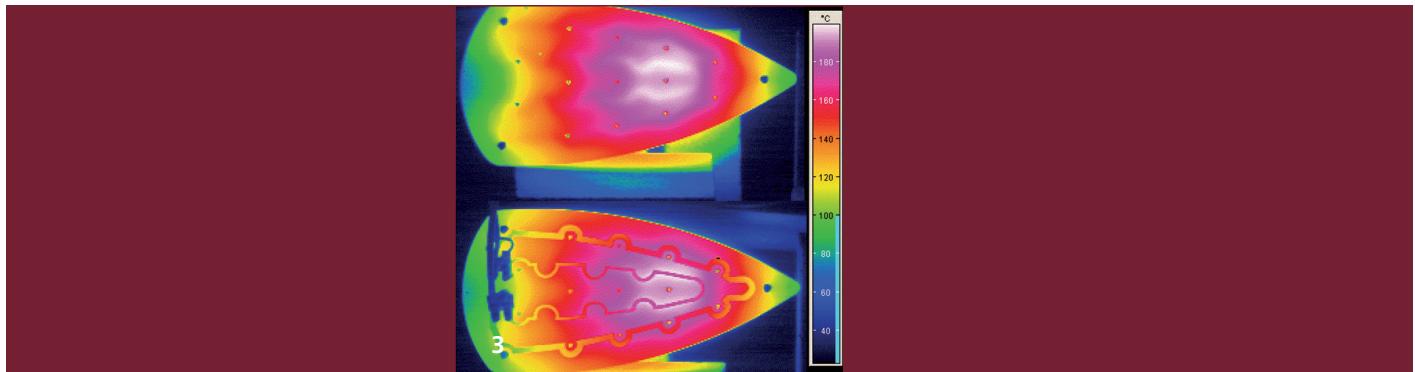
Dr. Lars Rebenkau

Telefon 0351 2553-7986

[lars.rebenkau@ikts.fraunhofer.de](mailto:lars.rebenkau@ikts.fraunhofer.de)

[www.ikts.fraunhofer.de](http://www.ikts.fraunhofer.de)

### FRAUNHOFER INSTITUTE FOR CERAMIC TECHNOLOGIES AND SYSTEMS IKTS



1 Integrated heater on AlN substrate.

2 Layout of a heater pattern on  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramic substrate, for example: bottom of a flat iron.

3 Picture of the distribution of temperature on  $\text{Si}_3\text{N}_4$  bottom of a flat iron (sliding side and heater side).

## INFRARED THERMOGRAPHY

### Motivation

The distribution of temperature belongs to the most important parameters of designing of heating modules and devices. In many applications the time dependent analysis of temperature is important, for instance during heating and impulse heating or for controlling chemical processes. Furthermore, the thermography is suitable for detecting and localizing critical or defected points in devices which are caused even from little overheating.

- The fast focal plane array Vario-Therm in the near IR range ( $3.4 \mu\text{m}$  to  $5 \mu\text{m}$ ) with maximum 50 frames/s and position resolution of  $25 \mu\text{m}$
- The temperature range extends from  $40^\circ\text{C}$  to  $1200^\circ\text{C}$

### Services offered

- Analysis of the static or transient distribution of temperature on heating modules and electronic devices is subject to various electrical and thermal loads
- Performing load tests on heating devices and film resistor patterns with different load conditions which can be constant, stepwise increasing, or pulselike heating

### Equipment

Following infrared camera systems (produced by JENOPTIK Jena) are available:

- The scanning high resolution (up to  $0.03 \text{ K}$ ) IR system Vario-Scan in the far IR range ( $8 \mu\text{m}$  to  $12 \mu\text{m}$ ) with a maximum recording rate of 1 frame/s or 200 lines/s

### Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS

Winterbergstrasse 28  
01277 Dresden, Germany

#### Contact

Dr. Lars Rebenkau  
Phone 0351 2553-7986  
[lars.rebenkau@ikts.fraunhofer.de](mailto:lars.rebenkau@ikts.fraunhofer.de)

[www.ikts.fraunhofer.de](http://www.ikts.fraunhofer.de)